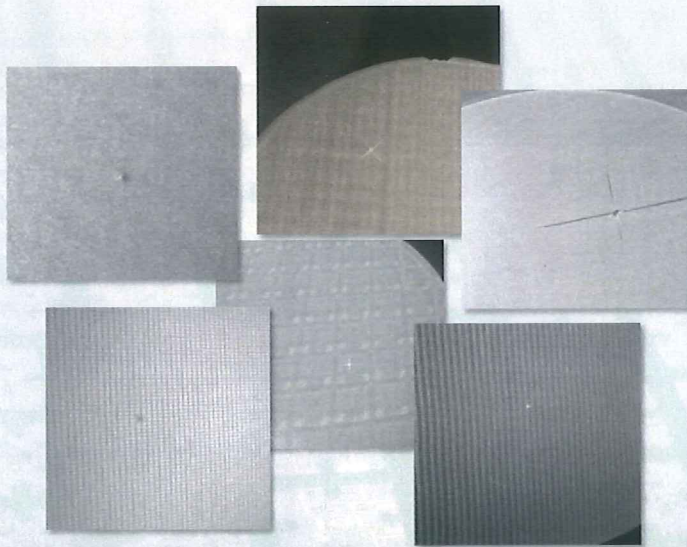


ウェハクラック検査装置

WAFER CRACK INSPECTION SYSTEM

SEL-WCISシリーズ

- ウェハー一括撮像・検査(1ショット/1枚)
- 目視では発見が困難な、ウェハの微細クラックを特殊な光学系と画像処理で検出します。
- クラックの入っているウェハを色分け表示。
クラックの座標位置をマップ表示。

特許出願中

《特長》

- ・1ウェハ1ショットの為、高スループット。
- ・光源にLEDを使用している為、ランニングコストが殆ど掛からない。
- ・シンプルで高検出能力。
- ・幅500mmでレイアウトが容易。
- ・ユーティリティはAC100のみの為、設置が簡単。

《クラック検出可能ウェハ》

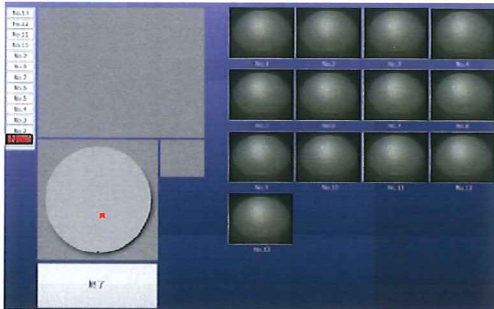
- ・ベアウェハ
- ・パターン付ウェハ
- ・薄ウェハ/厚ウェハ
- ・ダイシング前/後のウェハ
- ・ダイシングテープ上のウェハ
- ・BGテープ貼付ウェハ
- ・タイコウェハ

SPEC SHEET				
	WCIS-100 4inch	WCIS-150 6inch	WCIS-200 8inch	WCIS-300 12inch
検査対象ウェハ	・Si, 化合物半導体であれば、ウェハの種類は問いません。 (両面にフィルムが貼ってあるウェハは検査不可能) (著しく反ったウェハや鏡面で無いウェハは検出不可) ※1			
検査内容	クラックの検出・表示			
表示方法	・クラックを検出したウェハの番号を表示。 ・クラックを検出した場合、そのウェハの画像を自動保存 ・クラック位置座標をマップと座標位置で表示。			
スループット	15秒以内/1枚 ※2 (カセットよりウェハ引出し ⇒ 検査 ⇒ 収納まで)			別途お打合せ
照明	LED			
GUI	タッチパネル			
搬送系	カセット : 上下動エレベータ 検査ステージ : 一軸			別途お打合せ
装置サイズ	W : 500 X D : 1100 X H : 1800			別途お打合せ
電力	AC100V VA: 2K(MAX)			別途お打合せ
重量	約400kg		約450kg	
			別途お打合せ	

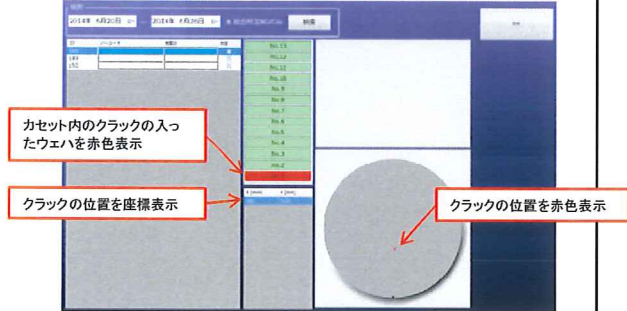
※1 その他のサイズのウェハ、サイズ違いの兼用、ダイシングリング付ウェハは別途ご相談ください。
 ※2 もっと高速なスループットをご希望の場合は別途ご相談ください。

オプション	
マップ情報との照合	どのチップにクラックが入っているか、マップ上に表示します。 (お客様のウェハのマップデータが必要となります)
上位通信 FFU	工場側の上位PCとの通信機能(SECS, GEM300など)

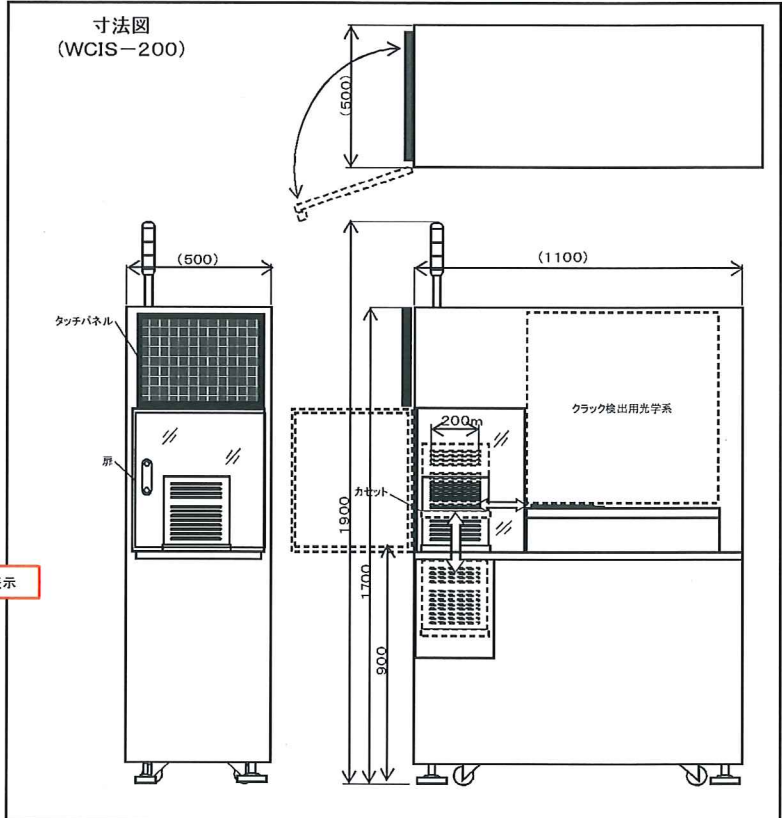
検査画面



結果表示画面



寸法図
(WCIS-200)



株式会社 昭和電気研究所

<http://www.showalabo.co.jp>

✉ info@showalabo.co.jp

〒819-0015 福岡市西区愛宕1丁目14-35

PHONE : 092-881-0238 FAX : 092-881-0217